## ■9 群(電子材料・デバイス)-8編(センサ・弾性波・機構デバイス)

# 1章 センサ

## 【本章の構成】

本章では以下について解説する.

- 1-1 センサの分類
- 1-2 物理センサ
- 1-3 化学・生物センサ

# ■9 群-8 編-1 章

# 1-1 センサの分類

## ■9 群-8 編-1 章

## 1-2 物理センサ

#### 1-2-1 磁気センサ

(執筆者:高村 司, Adarsh SANDHU) [2012年9月 受領]

磁気センサとは、外界における磁界の強さや変化を感じ取り、主に電気信号に変換し出力す る素子である.私たちは生活するうえで磁気センサによる恩恵を様々な形で受けている.例え ば、電気自動車や洗濯機などで使われるモータの回転数を計測したりコンピュータには欠かせ ないハードディスクなどの磁気記録媒体からの信号を検出したり、冷蔵庫のドアの開閉を非接 触で検知して照明のスイッチングを行ったりなど、その使用方法は多岐にわたっている.

磁気センサの種類として、ホール効果磁気センサ(ホールセンサ), MR (Magnetoresistive effect) センサ, GMR (Giant Magnetoresistive) センサ, SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), MI (Magnetoimpedance element) センサなど,検出原理・材料の異なった様々な磁気 センサがある.また,磁界に対する感度や分解能,温度特性,作製及び運用コストなどが異な るため,使用目的に対して最適なセンサを用いることが重要である.ここではまず代表的なホ ールセンサと MR センサについて述べる.

### (1) ホール効果磁気センサ

ホールセンサとは、ホール効果と呼ばれる現象を利用し磁場の大きさやその向きを電圧とし て出力することのできる四端子の磁気センサである.この現象を支えているのが物質中に移動 する電荷に働くローレンツ力と呼ばれる力であるので、まずその力について説明する.

#### (a) ローレンツカとは<sup>1)</sup>

電荷は一様電界中では加速度運動を行う.その運動方向は正電荷の場合は電界方向であり, 負電荷の場合は反対方向に加速されるわけであるが,そのときに磁場を印加されると電荷は磁 場から力を受ける.その向きは正電荷の場合は電荷の速度ベクトルの向きから磁場方向へ右ね じの進む方向であり,電荷に働く力は下記のような式で表すことができる.

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

 $(2 \cdot 1)$ 

式(2·1)の第一項目は電界による力で、二項目がローレンツ力である. q は電荷の電気量, E は印加された電界, v は電荷の移動速度, B は電荷に加えられた磁場の磁束密度である.

## (b) ホール効果とは<sup>2)</sup>

上で述べたような力が金属や半導体中のキャリア(電荷)にも作用し、結果的に先に述べた ホール効果という現象を引き起こすことになる.具体的に正電荷がキャリアとして考えられる p型半導体に電流を流し磁場を印加したときのキャリアの様子を考えてみる.

まず,図2・1のようなy方向に長さ*l*,x方向に幅w,z方向に厚さ*d*の直方体のp型半導体 を考え,長さ方向に電圧を印加し素子中に電流*I*が流れたと仮定する.磁場印加直後,キャリ アである正電荷のホールは先に述べたローレンツ力によって電流*I*に対して直角の方向に力を 受けて図の斜線部へ集まることになるが,その集まることでその向かい側の端面と電位差を生 じx軸方向に電界を発生させることになる.ついには発生した電界と磁場からのローレンツ力



図2・1 磁場を印加したときのホールセンサ

とが釣り合い,キャリアは再びy軸方向にのみ移動をする.このように磁場を印加することで 電流方向と垂直の面の間に電位差を発生させる現象のことをホール効果と呼び,このときキャ リアによって生み出された電位差をホール電圧 V<sub>H</sub>と呼ぶ.以下で先の現象を式を用いて定量 的に考え,ホール電圧を導出する.

ホール電圧によって生み出された電界 E<sub>H</sub>(ホール電界とも呼ぶ)は

$$E_H = \frac{V_H}{W} \tag{2.2}$$

である.この電界からキャリアが受ける力とローレンツ力が釣り合うことから

$$qE_H = qvB \tag{2.3}$$

という関係になる.一方,電流1は素子中のキャリア密度をpとすると

$$I = qpvdw \tag{2.4}$$

とおけるので式(2・2)から式(2・4)を整理することにより

$$V_H = \frac{IB}{qpd} \tag{2.5}$$

を得る.一般的にはホール係数 R<sub>H</sub>というのを導入して

$$V_H = \frac{R_H I B}{d} \tag{2.6}$$

ただし,

$$R_{H} = \frac{1}{qp} \tag{2.7}$$

というような表現が一般的である.もしもキャリアが電子である場合はホール電界の方向が逆 になることに注意して素子中の電子密度を*n*とすると

$$R_H = -\frac{1}{qn} \tag{2.8}$$

となり、半導体においては  $R_H$ の正負、すなわち  $V_H$ の正負から伝導型を特定することが可能である.

4

式(2・6)から分かるように、このセンサは磁場の大きさに比例してホール電圧を出力できる こと、またその電圧の正負から磁場の方向までも検出できることが特徴である.また、素子の 厚さ d を薄くすればするほど高いホール電圧の出力を得ることができるので、素子の薄膜化が 重要である.また、キャリア濃度が小さいほど良いが、あまりに小さくすると真性伝導となり 温度依存性が非常に高くなることに気をつけなくてはならない.使用環境・目的に合わせた材 料やドーピング濃度を適切に選択する必要がある.

現在の実用ホールセンサは高移動度の InSb や InAs をマイカやアルミナなどの絶縁基板上に 真空蒸着法によって薄膜を堆積させたり,分子線エピキタシー(MBE)法を用いて,膜厚を精 度良く調整し,高移動度なホールセンサを実現している.高移動度材料であれば定電圧でホー ルセンサを駆動させたときのホール電圧の増大が見込める.また,許容温度上昇に制限がある 場合に駆動時に発生するジュール熱による駆動電流の制限が発生するため,できるだけ入力電 力に対して効率的にホール電圧の出力を取り出すことが必要になってくる.入力電力に対する 出力の電力特性は移動度の2乗に比例するため,ここでも高い移動度を持つ材料が好ましいこ とがうかがえる.

#### (2) MR センサ

MR センサとは、磁気抵抗効果と呼ばれる磁場を垂直に印加したときに素子の抵抗が増加す る現象を利用して磁場を検出する2端子のセンサである.センサの出力は印加磁場に対してど ちらの向きに対しても増加するため磁場の方向を検出できないが、抵抗値の変化なのでセンサ を直列に接続することで抵抗値を積算でき高感度にすることが可能である.また、低磁場より 高磁場中での変化をより高感度に検出することが可能であるといった特徴もある.

半導体の磁気抵抗効果においては、キャリアの散乱に伴う電流パス増加の結果として抵抗値 が増加して見える物理的磁気抵抗効果もあるが、端子付近のホール効果緩和による形状的磁気 抵抗効果が主な要因として挙げられる.ともにキャリアの移動度が高ければより大きい変化を 引き起こすが、特に同一の材料であってもその加工によって形状が変わってしまうと抵抗値の 変化量が著しく変化する形状的磁気抵抗効果について説明する.



図2・2 MR センサの形状磁気抵抗効果

磁気抵抗素子の概略図を図2・2に示す.磁場がない場合は、電流は素子内を直進する.次に、 素子に垂直に磁場を印加すると先に述べたとおり素子中に流れるキャリアに磁場からローレ ンツ力が働き、その後溜まったキャリア自身が生み出したホール電界からの力と釣り合うこと でキャリアは磁場がないときと同じようにまっすぐと進行し出す.しかし、実際は図2・2に示 したように端子付近で大きく曲がることになる.なぜなら、電流を流す端子によってホール電 圧は短絡されることになり素子中で一定ではなく端子付近でローレンツ力が支配的となり、結 果として電流パスが長くなり抵抗値は増加する<sup>3)</sup>.特に電流の長さ方向に対して幅が大きくな ればなるほど長さ方向に対して直線的にキャリアが移動する部分が小さくなり、抵抗変化量は 大きくなる.最大はコルビノ素子と呼ばれる円形の素子で、中心から縁に電流を放射状に流す ことで実質的にホール効果の影響をなくすことができる.

なお、形状的磁気抵抗効果の理論式は下記のように表すことができる.

$$\frac{R}{R_0} = \frac{\rho}{\rho_0} (1 + g\mu^2 B^2)$$
(2 • 9)

ただし,  $R_0 \ge R$ ,  $\rho_0 \ge \rho$  はそれぞれ磁場印加前と後の素子の抵抗値と抵抗率を示す. また, g は素子の形状因子である.

形状効果を最大限引き出すために幅に対して長さ方向を短くすることが重要であると述べ たが、そうすると抵抗値そのものが小さくなってしまうため計測において実用的ではない. そ こで、実際には図2・3のように帯状に電極を多数付けることで、一個一個の素子を直列に接続 するような構造をとることで十分な抵抗値とより高感度なセンサを実現している.



図2・3 直列に接続した MR センサ

## (3) 最新の動向

最近の動向として、より高感度に検出するために半導体と金属のハイブリッド構造をした EMR (Extraordinary Magnetoresistance) 効果という現象が報告されている<sup>4</sup>. また、ただ磁界を

検出するだけでなく更なる付加価値を付けていく 流れがある.例えば、今まで以上の高温下での磁場 測定をするためにバンドギャップの大きな GaN と いう材料を用いて磁気センサを作製・計測する試み が行われている<sup>5)</sup>.また図2・4のように、生体物質 には磁気を含まないため磁気センサと磁性マーカ ーを用いてSN比の非常に高いバイオ物質機構の開 発が盛んである<sup>6,7)</sup>.



#### ■参考文献

- 1) 稲荷隆彦: "基礎センサ工学," pp.53-56, コロナ社, 2001.
- 2) 森泉豊栄, 中本高道: "センサ工学," pp.38-40, 昭晃堂, 1997.
- 3) 電気学会: "センサ材料-基礎と応用-," pp.14-17, コロナ社, 1999.
- S. A. Solin, Tineke Thio, D. R. Hines, and J. J. Heremans : "Enhanced Room-Temperature Geometric Magnetoresistance in Inhomogeneous Narrow-Gap Semiconductors," Science, vol.289, no.5484, pp.1530-1532, 2000.
- S. Koide, H. Takahashi, A. Abderrahmane, I. Shibasaki and A. Sandhu : "High Temperature Hall sensors using AIGaN/GaN HEMT Structures," J. Phys. Conf. Ser., vol.352, 012009, 2012
- A. Sandhu, Y. Kumagai, A. Lapicki, S. Sakamoto, M. Abe, and H. Handa : "High efficiency Hall effect microbiosensor platform for detection of magnetically labeled biomolecule," Biosens. Bioelectron., vol.22, pp.2115-2120, 2007.
- Y. Morimoto, T. Takamura, R. Ishikawa, P.J. Ko, and A. Sandhu : "Amplification of direct current magnetic responses of magnetic nanobeads due to induced self-assembly of magnetic microbeads," J. Appl. Phys., vol.109, 07E516, 2011.

## 1-2-2 光・赤外線・熱センサ

(執筆者:木村光照) [2012年6月受領]

光センサは、広義には紫外線や赤外線も含み、可視光(波長:0.38~0.78 μm)付近の電磁波 の検出器であり、光電変換を利用する量子型と、光を吸収して熱に換えて温度センサと組み合 わせて温度検出する熱型センサ(熱センサ)に大別される.可視光付近や近赤外線領域では、 受光する光子のエネルギーが大きいので、高感度で高速応答性の量子型の光センサが用いられ る. 中赤外線以上の波長の赤外線センサは、室温では量子型が冷却を必要とするので、簡便な 赤外線センサとして波長依存性が小さい熱型センサが用いられる.

量子型センサでは、光エネルギーE [eV] と波長 $\lambda$  [ $\mu$ m] との次の関係式を用いるとよい.

 $E \,[\text{eV}] = 1.2398/\lambda \,[\mu\,\text{m}]$ 

 $(2 \cdot 10)$ 

### (1) 光センサ

可視光域付近の光センサには、光電効果を利用した受光部の光電陰極からの二次電子を電界 加速して、ダイノードを通して1個の光電子が1000万倍以上にも増倍される高感度の光電子 増倍管 (Photomultiplier Tube)や、半導体の価電子帯や不純物準位から伝導帯に電子を励起し、 そのとき発生した電子や正孔の流れ(光電流)を利用する半導体光センサがある.

半導体光センサには、光導電セル、半導体接合を用いたフォトダイオードやフォトトランジ スタがあり、フォトダイオードには、特に雪崩増倍機能を持たせて、高感度で高速動作できる ようにしたアバランシェフォトダイオード(APD)がある.ここでは、広く用いられている量 子型の光センサである半導体光センサの原理を示す.

#### (a) 光導電セル

半導体のバンドギャップ ( $E_{g}$ ) 以上の光子エネルギーの光を吸収して、価電子帯に電子の抜け殻である自由正孔を残し、そのとき伝導帯に電子が励起されて自由電子となる、いわゆる、対生成して導電率が大きくなる現象を光導電効果 (Photoconductive Effect) という (図 2・5 参照). 光導電セルは、この光導電効果を利用した量子型の受光素子である.分光感度特性が、人間の視感度特性に近いことから、CdS や CdTe などの半導体材料が主に用いられ、照度計やカメラの露出計に使用されている.



図2・5 光子吸収による電子・正孔対生成

(b) フォトダイオード

バンドギャップ ( $E_g$ )以上の光子エネルギーの照射光の吸収により発生した電子・正孔対は, pn 接合付近では拡散により動き回り, pn 接合部に入る.そこでは電界によりポテンシャル(電 位)に傾斜(坂)があり,電子はn型に,正孔はp型に寄せ集められる.したがって,太陽電 池の発電原理と同じく pn 接合の順方向電圧が発生する光起電力効果で,n型は負の電位,p型 は正の電位になり,この電圧差から光を計測することができる.しかし,光起電力効果は,電 源も不要でノイズも小さいが,応答速度が遅く出力が小さいので,一般には,図2・6に示すよ うに負荷抵抗  $R_L$ を介してフォトダイオードの pn 接合に逆方向電圧を印加して,極めて小さな 暗電流の状態で光計測する方法を採用する.そこでは,光照射により発生した自由電子・正孔 対を逆バイアス pn 接合による急峻な電位の坂を高速に走行させて流れる光電流を負荷抵抗  $R_L$ での電圧降下として電圧出力とする.電子の移動度が正孔のそれよりも一般に大きいので,光



図2・6 フォトダイオードでの光検出

を p 型半導体側で多くを吸収させるようにし、そこで発生した少数キャリアの電子が pn 接合 の電位の坂に到達しやすいようにする. 真性半導体層(i 層)を挿入した pin フォトダイオード では、電位の坂になる i 層で光吸収がしやすいことや接合容量が小さくできるから高感度で高 周波まで応答できる光センサとなる.光ファイバを用いた光通信などに多用されている.

#### (c) フォトトランジスタ

フォトトランジスタは、エミッタ(E)-ベース(B)-コレクタ(C)の三層構造であるが、Bから は電極を取り出さずに、電位的に浮かした構造にしてある.npn型では、光吸収で発生した電 子・正孔対のうち、正孔が電位の坂を移動してp型のBに溜まる.このときBは正の電位にな り、E-B間の電位障壁の高さが小さくなるので、Eから沢山の多数キャリアである電子がこの 障壁を越え、狭いB領域をほとんど再結合せずに通って、逆バイアスのために急峻になったB-C間の電位坂を電子が駆け下り、この光電流がコレクタ電流となり負荷抵抗 R<sub>L</sub>を通して電圧 出力となる.フォトダイオードに比べ応答が遅いが高感度で、フォトカプラなどの光スイッチ に用いられる.

## (2) 赤外線センサ

近赤外線領域(波長 0.7~2.5 µm)では、光子のエネルギーが室温(300 K)のエネルギー(約 25.9 meV)より充分大きいので、比較的大きなバンドギャップ Eg や活性化エネルギーEa を持 つ半導体を用いることができて、赤外線を照射しないときの電流である暗電流が小さく、上記 した量子型光センサが用いられる.冷却することにより暗電流を減らすことができるので、中 赤外線以上の波長域の赤外線でも高感度、高速応答が得られる量子型赤外線センサとして使用 することができる.しかし、冷却装置が必要で大型化し、高価になるので、簡便な熱型赤外線 センサを使用することが多い.

熱型赤外線センサは、赤外線を受光部で吸収させ熱に変換し、受光部に搭載した温度センサ でその温度変化分を計測して赤外線の受光量を求めるものである.特に、遠赤外線の波長域(4 ~1000 μm)の赤外線の検出には、この熱型赤外線センサが非冷却型として、単独の受光部や 二次元配列のピクセル(画素)としたイメージセンサが多用されている.

熱変換なので、感度が赤外線の波長依存性がほとんどなく、光の全エネルギー測定には有用 である.一般に受光部を基板から支持されるが熱分離するために宙に浮かした赤外線吸収膜を 持つ薄膜構造にしている.

熱型赤外線センサには、焦電型,抵抗ボロメータ型,熱電型センサやダイオード型などがある<sup>1)</sup>. 焦電型は、単結晶(LiTaO<sub>3</sub>)やセラミックス(PbTiO<sub>3</sub>)など焦電材料である強誘電体の 自発分極 Ps を利用し、赤外線入射により受光部に温度変化  $\Delta T$  を与えると、焦電係数に比例 した電荷が受光素子表面に現れ、間もなく中和されるが、そのときの瞬間的な発生電圧を検出 する.抵抗ボロメータ型は、金属や半導体の抵抗温度係数(TCR: Temperature Coefficient of Resistance)  $\alpha$  を利用して赤外線の吸収と放射とのバランスによる $\Delta T$  を抵抗変化で検出する. 熱電型センサは、熱電対やサーモパイルを赤外線受光部に形成して $\Delta T$  をゼーベック効果

(Seebeck Effect) による熱起電力で検出する(図2・7参照). ダイオード型は, pn 接合ダイオードの温度変化による順電圧または順電流変化から*ΔT*を検出する<sup>2)</sup>.

絶対温度 Tの黒体から放射される電磁波エネルギーI [W/m<sup>2</sup>] は、ステファン・ボルツマン 定数 $\sigma$  (~5.67×10<sup>-8</sup> W/m<sup>2</sup>T<sup>4</sup>) として、ステファン・ボルツマンの法則、



図2・7 熱電型サーモパイル赤外線センサ

 $I = \sigma T^4$ 

 $(2 \cdot 11)$ 

で与えられる.この式(2·11)を利用し、放射率  $\varepsilon$  ( $\leq$ 1)を考慮してIを計測して、放射温度計として非接触で物体の温度Tを計測することができる.

(3) 熱センサ

熱センサは,被計測物理量である赤外線,流量や気圧などを熱の授受に基づく温度変化*AT*に 変換して計測するセンサであり,次の熱方程式に従い,微小の入力パワーWで大きな温度変化 *AT*が得られることが望ましい.集中定数的に考えたセンシング部に熱パワーWが発生したと き、*AT*だけ温度上昇したとすると,熱方程式は,

#### $(d\Delta T)/dt + G\Delta T = W$

(2 · 12)

で表される.ここで、Cは発熱部の熱容量、Gは熱が発熱部から外部に逃げるときの熱コンダ クタンスである<sup>3)</sup>.定常状態では、 $\Delta T = W/G$ となり、熱時定数  $\tau$ は、 $\tau = C/G$ で表される. Wは、ヒータのジュール熱のように内部に発生する熱でも、マイクロ波や赤外線吸収のように外 部からのパワー供給によるものでも良い. Wを負とすれば冷却である.

熱センサで重要なことは、高速応答と高感度化のために、τとGとを共に小さくして、被測 定物理量とに関わる表面積を大きくすることで、宙に浮く薄膜形状が最適となる.

熱センサでは、一般に MEMS (Micro Electro Mechanical System) 技術を利用して製作し、照 射された赤外線を基板から熱分離した受光部で熱に換えて $\Delta T$  を検出する上述の熱型赤外線セ ンサ、熱分離のために宙に浮かした薄膜にヒータ  $^{+0}$  と温度センサを搭載して、ヒータでのジュ ール熱を熱伝導型センサとして放熱に基づく $\Delta T$  を温度センサで検出するフローセンサや気圧 センサなどがある. 図 2.8 に、熱センサの一例として、ガスフローセンサの構造と原理を示 す<sup>5</sup>. 中央の Pt ヒータでメンブレンを加熱しておき,気流がないときには,両側の Pt 薄膜温 度センサは同一の温度であるが,気流があると風上側の温度が低下し,風下側の温度が低下す るので,これらの温度差から校正により流速などに換算するものである.



図2・8 ガスフローセンサの構造例

#### ■参考文献

- 室 英夫,藍 光郎,石垣武夫,石森義雄,岡山 努: "マイクロセンサ工学," pp.69-72,技術評論社, 2009.
- M. Kimura and K. Toshima : "Thermistor-like pn junction temperature-Sensor with variable sensitivity and its combination with a micro-air-bridge heater," Sensors and Actuators, A108, pp.239-243, 2003.
- 3) E.L. Dereniak and D.G. Crowe : "Optical radiation detectors," p.136, John Wiley & Son, 1984.
- M. Kimura : "Microheater and microbolometer using microbridge of SiO2 film on silicon," Electronics Letters, vol.17, no.2, pp.80-82, 1981.
- 5) 長田光彦,上運天昭司,黒澤 敬,山本友繁: "流速センサ,"公開特許公報,特開平 4-5572, 1992.

## 1-2-3 加速度・カセンサ

(執筆者:前中一介) [2012年7月受領]

加速度センサ,角速度センサなどの慣性力センサは、1990年代以降,エアバッグ作動のため の衝突センサ,カメラ・ビデオの手ぶれ補正,車両制御,携帯端末やゲーム機の入力デバイス として急激に民生品への導入が進んできた.特に,MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術の進展とともに超小型化,高機能・高性能化,低消費電力化などが進み,最も普及した物 理センサの一つに成長している<sup>1)~4)</sup>.慣性力は,加速度(や角速度)によって質量に発生する 力を,その質量を支えるバネの歪みや変位によって検出することができる.ここでは加速度セ ンサ及び力センサに関して述べる.

力を検出するためには、その力による変形や変位を計測できればよい.例えば、図 2・9 のような片持ち梁のバネに吊られた質量 m を考える.質量に力 F を与えると、バネはそのバネ常数を k とすると、x=F/kの変位を発生する.このとき、梁上にはこの変位による表面応力  $\sigma$  が発生している.加速度  $\alpha$  を与えた場合は慣性力として  $F = -m\alpha$  が与えられることになる.変位や応力を計測すれば与えられた力、または加速度を得ることができる.以下、これらの具体的な計測手段について述べる.



図2・9 力及び加速度の検出

#### (1) 変位を計測する方法

変位計測手法としては,固定電極を形成し,例えば質量部分に固定電極と対向する形で可動 電極を設け,この間の距離の変化xによって,電極間の静電容量

 $C = \varepsilon A / (d_0 + x)$ 

ただし, ε: ギャップ間の誘電率, A: 対向する電極の総面積, d<sub>0</sub>: 電極間の初期ギャップ長. を計測する方法がある. 最近の MEMS 加速度センサ及び角速度センサのほとんどはこの手法 を計測手段としている. その他, 差動トランスを用いたものや光を用いた手法などもある.

## (2) 応力を計測する方法

応力を計測する方法としては、応力による材料の歪みを検出原理とするもので、歪みゲージ、 ピエゾ抵抗素子、圧電素子を用いたものなどがある.

歪みゲージは,厚さ t,幅 W,長さ L,抵抗率  $\rho_0$ の材料を長手方向(L 方向)に力を加え, これによる材料の変形を長手方向の抵抗値変化として得るもので,初期抵抗値

 $R_0 = \rho_0 L/(Wt)$ 

が、変形によって

 $R = \rho \left( L + \Delta L \right) / \left( \left( W - \Delta W \right) \left( t - \Delta t \right) \right)$ 

となることを利用する. ここで, ρは歪みが与えられたときの材料の抵抗率で, 一般の金属の 場合は ρ₀とほぼ同一である.

 $\Delta L$ は力印加によって発生した長手方向(L方向)の伸びで、長手方向の歪み $\varepsilon$ と応力 $\sigma$ との関連は

 $\varepsilon = \sigma/Y = F/(Wt)/Y = \Delta L/L$ 

ただし,Yは材料のヤング率であり,ΔW,Δtは材料の伸びに基づく伸び方向に垂直な断面の 縮みで,等方性の材料の場合

 $\Delta W/W = \Delta t/t = v \varepsilon$ 

ただし、vはポアソン比(通常の金属の場合 0.3 近辺)となる.

歪み $\varepsilon$ で規格化した構造変形前後の抵抗変化率(ゲージファクタ) $G = (R - R_0) / R_0 / \varepsilon$ は,近 似計算によると

 $(1+2 v)\varepsilon + (\rho - \rho_0)/\rho_0$ 

となる.

歪みを計測する薄膜ゲージとして用いられる銅ニッケル合金やニクロム系合金膜では既に 述べたように歪みによるρの変化は少なく,ゲージファクタ G は概略 2 程度の値にとどまる. ー方,シリコンに代表される半導体材料では,歪みによりバンド構造に変化が生じ(この効果をピエゾ抵抗効果と呼ぶ),歪み印加前後でρの変化が極めて大きくなる場合がある.これは半導体の種類,p型・n型の別,不純物濃度,結晶方位に大きく依存するが,典型的にはゲージファクタ 100~150 程度が得られる.結晶方位に注意すれば,このゲージは標準集積回路の抵抗として容易に作製でき,MEMS型デバイスで応力を計測する際にはこのピエゾ抵抗型の検出機構がよく用いられる.

応力を検出する機構として最後に圧電型について述べる. PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)や AIN(窒化アルミニウム),有機系のPVDF(ポリフッ化ビニリデン)などの圧電材料は,歪み を加えると電荷を発生し,逆に電界を与えると歪みが発生する.これを利用し,例えば薄膜を 梁上に形成して生じた歪みから電気信号を取り出す,あるいは材料に直接力を印加する(例え ば,マスを材料上に直接貼り付けて加速度に対する発生力を材料に与える)ことによって与え られた力・応力を電気信号として取り出すことができる.ただし,発生するのは応力に比例し た「電荷」であり,一般的には出力信号はリーク電流によって時間的に消滅していくため,静 応力を検出するのには適切ではない.

圧電材料では材料定数として*d*定数,*g*定数などが定義されている. 応力印加による発生電 圧を直接記述する常数は*g*定数であり,圧電体の分極方向(添え字3で示される)に応力*σ*を 印加したときにその方向に発生する電界*E*は*E*=*g*<sub>33</sub>*σ*となる. なお,図2・9のような梁上に薄 膜状の圧電体(分極は厚み方向)を形成し,その膜の上下(裏表)方向に電極を形成したとき には電極面に平行に歪み*σT*が与えられることになり,この場合に発生する電界は*g*<sub>31</sub>*σT*と記 述できる. *g*<sub>33</sub>, *g*<sub>31</sub>の値の例として, PZTでは*g*<sub>33</sub> は 20×10<sup>-3</sup> Vm/N 程度, *g*<sub>31</sub>は -10×10<sup>-3</sup> Vm/N 程度,AIN の場合はそれぞれ 40×10<sup>-3</sup> Vm/N, -50×10<sup>-3</sup> Vm/N 程度の値である <sup>5,6</sup>.

以下,具体的な力センサ及び加速度センサについて例示する.

(3) カセンサの例

棒状,板状の構造体に与えられた力,シャフトに発生するトルクなどを検出する場合,歪み ゲージを対象物に貼り付けることによって構造体の歪みを検知し,外力を検出することができ る.図2・10にその例を示す.薄膜状の歪みゲージが市販されており,これを構造体に強固に 貼り付ける.構造体に対してゲージが十分薄い場合,構造体に発生する歪みを直接検知し,構 造体のヤング率,断面積によって与えられた力が計算できる.また,シャフトに与えられたト ルクはシャフト外周に斜めに貼り付けたゲージでシャフトのねじれを歪みとして受け取り,ト ルクを算出することができる.





なお,図 2・9 のような構造の梁上にゲージを貼り合わせる場合,梁の曲がりに対するゲージ 位置での歪みを検出することになり,梁の表にゲージを貼る場合と裏に貼る場合には正負逆の 出力が発生することになる.また,梁幅が等しい場合には梁の位置によって発生する歪みが異 なるため,材料力学に沿って歪み分布を計算し<sup>7</sup>,その積算値としてゲージ出力を取り扱わな ければならない.

## (4) 加速度センサの例

次に加速度センサについて述べる.本節冒頭に述べたように,特に MEMS 加速度センサは 近年の民生品に多数導入されている. MEMS 加速度センサの場合,検出機構は半導体ピエゾ抵 抗で質量を支えるバネ部の応力を検出する形式,及び質量の変位を電極間の静電容量で検出す る形式が一般的である.

近年は,

- ① ピエゾ抵抗は強い温度特性を持ち,高精度の検出が難しいこと
- ② ピエゾ抵抗式では一般的には大きな歪みを発生させるために大きな質量を形成するため バルク加工(ウエハ全体を貫通エッチングするなど)がもっぱら使われ、スペース効率及 びプロセスコストが必ずしも良好ではないこと
- ③ 逆に微小な静電容量変化を高精度に計測する回路の熟成とその同一パッケージ内での集積化技術の向上によって静電容量式のメリット、すなわち検出原理そのものに温度依存性がなく、またチップの表面加工のみによって構造形成が可能な点などが活かせるようになってきたことから、主流は静電容量型になっている。

ここでは,静電容量式3軸加速度センサについて例示する.ここでは,シリコン表面に数~ 数十µmの厚さの薄膜を形成し,その薄膜を一部を残してシリコン基板から浮かせることによって可動構造体を形成したデバイスについて示す.

図 2・11 に概念図を示す. 図(a)は基板表面に平行な x,y 軸方向の加速度を検出するデバイス, 図(b)は基板と垂直な z 方向の加速度を検出するデバイスである.いずれも一部(図(a)では中央 1 箇所,図(b)ではねじりバネの先端 2 箇所)で基板に固定されており,それ以外の部分は基板 から浮いている.また,両者とも,基板固定された対向電極を設けてある.



図2・11 MEMS 技術による3軸加速度センサの構造例

図(a)では、中央の固定部から上下左右の4本のバネを介して周辺の可動質量を支えている. デバイスの中程には、可動質量に接続された櫛歯状の電極と対向するように固定電極が設置さ れており、両者間で4組の静電容量を形成している.いま、x方向に加速度が加わると可動質 量は右に動き、Cx+と示される電極では静電容量として主となる電極間が狭まる方向、Cx-で は広がる方向に変位し、結果として静電容量 Cx+は増加、Cx-は減少する.y方向についても 同様である.この差動的な静電容量変化を周辺回路で精度良く検出することによって与えられ た加速度を得る.ここでは櫛歯は1つに静電容量に対して3本しか描かれていないが、実際に は多数の櫛歯を形成して静電容量の変化の絶対値を大きくする工夫がなされる.

また,図(b)のデバイスでは可動質量の中心からオフセットされた位置にねじりバネが形成さ れており, z 方向の加速度印加によってねじりバネの上部は手前,下部は奥へ変位するトルク を受ける.可動構造体と対向して Cz+, Cz- の位置に固定電極を形成しておけば,加速度によ ってこれらの電極と可動質量間の静電容量がやはり差動で変化する.

以上で3軸の加速度センサが形成できる.なお,バネを工夫して1つの構造体で3自由度を 持たせ3軸を同時に検出することも可能であるが,各軸の検出独立性及びご軸方向の感度設計 の容易なことからここで挙げた例のようにご軸を個別デバイスとすることも有利である.

また,MEMS デバイスではチップサイズが必然的に小さくなることから,得られる静電容量 は極めて小さく(fF=10×10<sup>-15</sup> F オーダ)これを精度良く安定に検出する回路と,そのアセン ブリ,更にはパッケージング手法も極めて重要な問題であるが,現在これらの問題も解決され, 様々なタイプの MEMS 加速度センサがデリバリされている.例えば 2012 年現在,パッケージ サイズが 2 mm 角の超小型 3 軸ディジタル加速度センサや消費電流がわずか 2  $\mu$ A 以下の超低 消費電力センサなども開発されている.

#### ■参考文献

- 1) 藍 光郎(監修): "次世代センサハンドブック," 培風館, 2009.
- 2) 桑野博喜(監修): "MEMS/NEMS 工学全集," テクノシステム, 2009.
- 3) 木股,他:"自動車用センサの最新動向,"シーエムシー出版,2009.
- 4) 藤田(編): "センサ・マクロマシン工学," EE Text, 電気学会・オーム社共同企画, 2005.
- 5) 江刺(監修): "MEMS マテリアルの最新技術,"シーエムシー出版, 2007.
- 6) 中村(監修): "圧電材料の高性能化と先端応用技術," サイエンス&テクノロジー, 2007.
- 7) 例えば、竹内洋一郎: "わかる材料力学," 日新出版, 1969.

## 1-2-4 触覚センサ

(執筆者: 篠田裕之) [2018年10月 受領]

人間の皮膚のように柔らかくどこにでも実装でき、人間の皮膚感覚あるいはそれ以上の情報 を取得できる万能人工皮膚を作ることは、ロボット工学の黎明期からの課題である.近年この ようなデバイスを実現するための基盤技術は大幅に進展しているが、想定される用途をすべて カバーできる万能センサは存在していないのが現状である.これまでに開発された触覚デバイ スを、その主目的で分類すると、主に次の3つのカテゴリ、すなわち、触感定量化用、物体把 持用、ロボット被覆用にまとめられ、それぞれ異なった優先事項を意識して開発が進められて いる<sup>1)</sup>.以下ではそれらの現状をまとめる.

## (1) 触感定量化センサ

第一のカテゴリは触感を数値化・データ化できるセンサである.このセンサの目的は、ヒト の指先が取得しているのと同等な触覚情報を知覚するセンサを実現することであり、当面の目 標としてそれがただちにロボットの表面全体を被覆できるものである必要はない.触感の定量 化においては、触覚の能動性・多面性と個人差という2つの問題に留意しておく必要がある.

## (a) 触覚の能動性・多面性

皮膚センサの出力が単独に存在するだけは不十分であり、手指がどのように対象物体に触れ るか、その運動の軌道とセンサ出力が対となることで初めて触感を表現するデータとなる.触 感は対象物体をつかむ、押す、撫でる、曲げるなど、対象に動きを与えたときの反応によって 生じるものであり、皮膚表面の力の分布が同一であったとしても、指の運動が異なっていれば 触感は異なったものとなる.

## (b) 個人差

触感は指と対象物との相互作用で生じた皮膚の変形や振動を知覚するものであるから,指の 表面の特性が変化すると,触感も変化する.また,個人差や加齢による変化も大きい.例えば, 硬い皮膚を持った人の指の特性を模倣して開発した指先センサで,ある物体に触れ,その計測 信号をもとに柔らかい皮膚を持ったほかの人の指を刺激することを考えてみよう.このとき後 者が感じる触感は,その人が実物に触れたときの触感とはいくらか異なったものになっている はずである.皮膚の硬さが異なれば,対象物体の変形の仕方も異なるし,皮膚表面の凹凸や摩 擦特性が異なれば,接触に伴って生じる振動も異なる.

#### (c) 触感定量化センサの実例

触感を厳密に定義しようとすると、前述のように厄介な問題が出てくるが、厳密さは後回し にしたうえでの実用的な取り組みは既に進んでいる. 布地の風合いを定量化する KES と呼ば れる手法では、引っ張り、曲げ、せん断特性や表面の摩擦係数などの測定値のセットによって 布地の触感を定量化している. また、一定の押し当て力と移動速度のもと、センサプローブで 物体表面をこすったときの振動波形は、人間が触感の差として見分けている表面性状の差異を よく反映している<sup>2)</sup>. MEMS によって人間の指紋形状を模倣し、羽毛の表面など柔らかい表面 の触感を定量化する試みも行われている<sup>3)</sup>.

このような触感定量化センサは、工業製品の表面の触感を定量化し、品質を管理するために 有効な技術である.その他、美容・健康のための肌状態の計測や、医師の触診すなわち腫瘍、 腫瘤、リンパ節などの検査の自動化、オンラインショッピングでの商品の触感伝送などへの応 用も期待されている.触覚ディスプレイと同時に使用し、テレイグジスタンスロボットの指先 の感覚をリアルタイム伝送する応用も、重要な研究テーマになっている.

#### (2) 物体把持用触覚センサ

第二のカテゴリは、自動作業するハンドの指先のためのセンサである.この応用において、 触感検出の能力が必ずしも人間のそれと同じ特性を持つ必要はない.指の表面における力分布 がベクトルとして正確に計測できることが重要であり、その精度、時間応答はむしろ人間の能 力を超えたものになることが望ましい.

物体の把持に必要な情報は、各指が物体に及ぼしているカベクトル・トルクと、物体と指の 間の滑りである.柔軟性を保ちつつ指表面のカベクトルの分布を計測するため、光学的手法が 古くから検討されていたが<sup>4</sup>、特に高精細撮像素子とコンピュータの小型化を背景として、リ アルタイムでのカベクトル分布計測をはじめて実証した指先型センサは文献 5)のセンサであ る.弾性体表面付近の微小マーカーの移動を指内部に埋め込まれたカメラで撮影し、マーカー の変位分布から表面の応力分布を推定する.

文献 6) のセンサは,接触力重心位置とそこに加わる力の総和を 4 本の信号線によって直接 計測する.力の分布を計測するセンサの場合には,指が物体に与える合力とトルクは分布デー タから計算によって求める必要があるが,このセンサの場合には分布データを経ることなく, 初めから接触分布重心の座標と力の総和が得られる.センサの面内には配線の必要がなく,物 理配線と計算量の両方を節約する合理的な構成になっている.このようなセンサを用いて接触 位置と力を 1 ms で検出することによって,高速ペン回しや片手ひも結びなどの動作が可能で あることが示されている<sup>7)</sup>.現在は,基礎研究だけでなく実用化も進展しており,SynTouch 社 BioTac など,物体把持に利用でき,同時に指先の微小振動も計測できる商用センサが入手可能 になってきている.

物体把持用触覚センサに求められるもう一つの役割は、滑り、特に把持していた物体が滑り 出す直前の状態を検出することである.初期滑り、すなわち全体の滑りが発生する直前に部分 的な滑りが生じている状態を検出する方法としては、滑り出す直前に顕著な振動が発生するよ うに表面性状を工夫し、指先に埋め込んだセンサで振動を検出する方法<sup>8</sup>, せん断変形の変化 を捉える方法<sup>9,10</sup> などがあったが、滑りとは直接関係のない振動と、滑りの予兆となる振動を 明確に区別することは難しかった.それに対し文献11)の研究では、初期滑りのみを安定に検 出する手法が示されている.ある種の感圧導電性ゴムにおいては、初期滑り時に高い周波数で 抵抗が変動する現象が見られる.それらの高周波成分は、垂直方向に物体が衝突したときや、 系全体が振動したときの信号にはほとんど含まれていないことから、初期滑り信号であること を確実に特定できる.

#### (3) ロボット被覆用触覚センサ

第三のカテゴリはロボットの全身を覆うことを目的とした触覚デバイスである.ロボットが 人間に接触した瞬間を検知して安全性を確保すること,皮膚を通したロボットと人間とのコミ ュニケーションを可能にすること,などが実用面から見た直近の目的である.このカテゴリに おける最優先事項は,実用的な丈夫さを持ち,柔らかく自由曲面を覆うことができることであ り,センシングの解像度や多様さは,後から除々に高めていけばよいというのが基本姿勢とな る.

触覚センサの分布計測法として最も古くから利用されている代表的手法は縦横電極の走査 を用いる方式<sup>12)</sup>である.配線のトポロジーとしてはこれと同様のものを用い,自由曲面に多 数のセンサ素子を実装することができる網目状デバイス<sup>13)</sup>が開発されている.網目の節に近 接覚センサが接続されており,網目の繊維に相当する部分を導線とする.導線が伸縮できない 材質であったとしても面としての伸縮性を確保することができ,自由曲面に実装することがで きる.これとは異なる考え方として,文献14)の研究では,センサユニットが通信機能を備え, センサユニットをシリアル結合で拡張できるようにした方式が採用されている.この手法によ って,人間型ロボットの表面にセンサを大規模実装できることを実証した.

更に完全に配線を排除する方法は、センサ素子を無線化することである.センサ素子と外部 コイルとの誘導結合を利用する方法<sup>15)</sup>や、柔軟体皮膚の内部を伝播するマイクロ波によって センサ情報を読み取る方式<sup>10</sup>が提案されている.研究は原理検証段階であるが、高機能な MEMS センサを大規模に実装するために有力な方法であると考えられる.

その他, EIT (Electrical Impedance Tomography)を用いた手法がある.荷重により抵抗が変化 する導電体シートの外周に多数の電極を配置し,導電体内部の抵抗値分布を,逆問題手法を用 いて計測する<sup>17)</sup>.人体の断層像を得る X線 CT スキャン (Computer Tomography Scanning)法 に比べると逆問題としての困難度は高いが,電気配線を排除することができ,柔軟な皮膚を構 成できる.

近年は、有機トランジスタを用いたセンサシート<sup>18)</sup>も実用段階に入りつつある.薄く伸縮 可能なシート上にセンサと回路を一括で形成することができ、将来的な発展が期待できる.

#### ■参考文献

- 下条 誠,前野隆司,篠田裕之,佐野明人(編):"触覚認識メカニズムと応用技術ー触覚センサ・触覚ディスプレイー,"サイエンス&テクノロジー,2010.
- 田中真美,長南征二,江鐘 偉,中島英貴: "触覚感性の計測:人間の触感と PVDF センサの出力の対比," 日本機械学会論文集 C編,65巻631号, p.970-976, 1999.
- K. Watatani, R. Kozai, K. Terao, F. Shimokawa, and H. Takao: "A "micro-macro" integrated planar MEMS tactile sensor for precise modeling and measurement of fingertip sensation," Proc. MEMS 2017, pp.223-226, 2017.
- 4) 前川 仁,谷江和雄,金子 真,鈴木夏夫,他:"半球面光導波路を用いた指先搭載型触覚センサの開発," 計測自動制御学会論文集,vol.30, no.5, pp.499-508, 1994.
- K. Kamiyama, K. Vlack, H. Kajimoto, N. Kawakami, and S. Tachi : "Vision-Based Sensor for Real-Time Measuring of Surface Traction Fields," IEEE Computer Graphics & Applications Magazine, Jan-Feb, pp.68-75, 2005.
- 石川正俊,下条 誠: "感圧導電性ゴムを用いた 2 次元分布荷重の中心位置の測定方法,計測自動制御 学会論文集,vol.18, no.7, pp.730-735, 1982.
- 7) 山川雄司,並木明夫,石川正俊,下条 誠: "高速多指ハンドと高速視触覚フィードバックを用いた柔軟 紐の結び操作,"日本ロボット学会誌, vol.27, no.9, pp.1016-1024, 2009.
- M.R. Tremblay and M.R. Cutkosky : "Estimating Friction Using Incipient Slip Sensing during a Manipulation Task," Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, pp.429-434, 1993.
- H. Shinoda and S. Ando: "A Tactile Sensor with 5-D Deformation Sensing Element," Proc. 1996 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, vol.1, pp.7-12, 1996.
- 10) 前野隆司,広光慎一,河合隆志: "曲面状弾性フィンガの固着・滑り分布推定に基づく把持力の制御," 日本ロボット学会誌, vol.19, no.1, pp.91-99, 2001.
- S. Teshigawara, K. Tadakuma, A. Ming, M. Ishikawa, and M. Shimojo : "High Sensitivity Initial Slip Sensor for Dexterous Grasp," 2010 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, pp.4867-4872, 2010.
- 12) 石川正俊,下条 誠: "ビデオ信号出力を持つ圧力分布センサと触覚パターン処理,"計測自動制御学会 論文集, vol.24, no.7, pp.662-669, 1988.
- M. Shimojo, T. Araki, A. Ming, M. Ishikawa : "A High-Speed Mesh of Tactile Sensors Fitting Arbitrary Surfaces," IEEE Sensors Journal, vol.10, no.4, pp.822-830,2010.
- 14) Y. Ohmura, Y. Kuniyoshi, and A. Nagakubo : "Conformable and Scalable Tactile Sensor Skin for Curved Surfaces," Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, pp.1348-1353, 2006.
- M. Hakozaki, H. Oasa, and H. Shinoda: "Telemetric Robot Skin," Proc. 1999 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, pp.957-961, 1999.
- 16) H. Shinoda, H. Chigusa, and Y. Makino : "Flexible Tactile Sensor Skin Using Wireless Sensor Elements Coupled with 2D Microwaves," Journal of Robotics and Mechatronics, vol.22, no.6, pp.784-789, Dec. 2010.
- 17) 長久保晶彦, アリレザーイーハサン, 國吉康夫: "逆問題解析に基づく触覚分布センサ,"日本ロボット 学会誌, vol.25, no.6, pp.162-171, 2007.
- H. Kawaguchi, T. Someya, T. Sekitani, and T. Sakurai : "Cut-and-Paste Customization of Organic FET Integrated Circuit and Its Application to Electronic Artificial Skin," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol.40, no.1, pp.177-185, 2005.

## 1-2-5 光ファイバセンサ・ジャイロ

(執筆者: 堀口常雄) [2012年6月 受領]

光ファイバセンサは、物理的及び化学的な量を、何らかの方法により光学的な量の変化に変換して測定し、その光信号の伝達や変換機構(トランスデューサ)に光ファイバを使用するものである。トランスデューサには光ファイバ以外のものを使用し、信号伝送の役割のみを光ファイバに担わせたものも光ファイバセンサとして分類している.

光ファイバセンサの最も重要な利点は、光ファイバ(特にガラス製光ファイバ)が電気的に 安定(無誘導性,高耐圧性,高絶縁性など),かつ化学的に安定(耐腐食性,耐水性,耐熱性な ど)なため,厳しい環境下においても使用可能なことである.また、光ファイバは細径で柔軟 性に富むので、狭く複雑な形状の空間の奥にある対象物にも光信号を伝送して測定することが 可能という利点もある.更に、光ファイバの低損失性を生かした光信号の伝送により、遠隔点 や、空間的に広がった測定対象にも適したものになっている.

測定対象となる物理的な量には、電界、磁界、歪み、温度、角速度、流速、振動、圧力、屈 折率、光スペクトルなどがある.また、それらの物理的な量の変化を知るために測定する、光 学的な量の種類には、光強度、周波数(波長)、位相、偏光などがある.

このように、光ファイバセンサは種々の情報量を測定可能であるが、ここでは、(1) 光ファ イバ内に屈折率格子を形成した FBG (Fiber Bragg Grating)の反射率あるいは透過率の変化を応 用したポイントあるいは多点型センサ、(2)同一種類の光ファイバが光信号の伝送とトランス デューサの役割を同時に果たすことにより、光ファイバの長さ方向に連続して分布した情報量 を測定可能な分布型センサ、及び、(3) 光ファイバの低損失性や、軽量、柔軟さに基づく収納 性などを活かし高感度化を図った光ファイバジャイロについて説明する.

(1) FBG センサ

光ファイバ内に周期 $\Lambda$ の屈折率分布を持つ FBG は、ブラッグ波長  $\lambda_B = 2 n_s \Lambda$ において高い 反射率を有する光フィルタとして利用される. FBG に応力が加わると、周期  $\Lambda$ の伸縮及び実



図2・12 FBG 多点型センサ

効的な屈折率  $n_g$ の増減により、 $\lambda_B$ も変化する ( $\Delta \lambda_B / \lambda_B = 7.69 \times 10^{-7} / \mu$  歪み).また,温度 変化に対しても同様な理由により $\lambda_B$ は変化する ( $\Delta \lambda_B / \lambda_B = 7.64 \times 10^{-6} / 1$  度).そのため、FBG は歪みや温度センサとして動作する. $\lambda_B$ の変化の検出方法には種々のものがあるが、主要な方 法は、発光ダイオードなど波長幅の広い光源と、波長掃引型の光フィルタを使用して、FBG か らの反射光のスペクトルを測定するものである. $\lambda_B$ が互いに十分離れた複数のFBG を使用す ることにより、多点型センサを構成することも可能である(図 2・12).その数は、発光ダイオ ードの波長幅と歪みまたは温度の測定レンジによって制限され、通常 5~6 個/ファイバである.

(2) 分布型光ファイバセンサ

光ファイバ自身がセンサとして機能する分布型光ファイバセンサは、光ファイバに沿った任 意の位置の情報量を測定可能である. その多くの測定系は OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)を基本とし、光ファイバに入射した短パルス光によって発生した後方散乱光が、 入射点へ戻ってくるまでの遅延時間から位置測定を行う.また、利用する後方散乱光は、レイ リー散乱、ブリュアン散乱、ラマン散乱などである.



図2・13 分布型光ファイバセンサ

レイリー散乱を利用する場合,感度を高めるために,測定したい情報量を光ファイバの損失 に変化させるトランスデューサを設けることが多い.その種のものとして,クラッド部にテフ ロンを被覆し,そこに浸透した油によって光ファイバのコアを伝搬する光が外部に放射するこ とを利用した油漏れセンサなどがある.一方,コヒーレントな短パルス光を入射することによ って発生した後方レイリー散乱の干渉信号波形が,光ファイバの歪みや温度によって変化する 現象を利用した,歪み・温度の相対変化センサも開発されている.後者のタイプのセンサは, 伝送特性や経済性に優れた通信用光ファイバを,特殊な加工を施すことなく使用可能という特 長を有する.

ブリュアン散乱光を利用した歪み・温度センサは、後方散乱光の周波数シフトが、光ファイ バの歪みや温度によって変化することを利用している.ブリュアン散乱は、音波(移動する屈 折率格子)よって散乱される現象であるので、ドップラ効果によって散乱光の周波数は変化す る.入射光に対するこの周波数変化量 f<sub>b</sub>をブリュアン周波数シフトという.通信用の石英ガラ ス光ファイバの場合、引っ張り/圧縮歪みが生じると、そのヤング率が増加/減少することが知 られている.ヤング率が増加すると集団的に変位したガラス分子がより速く振動の平衡位置方 向に戻るようになるので、分子の振動数、すなわち音波の振動数は上昇する(これは、弦の張 力を増すと弦の振れがより速く戻り、その振動数が上昇する現象と同様である).その結果、f<sub>b</sub> も増加する(約 50 kHz/1 μ 歪み).温度が変化する場合も同様の理由により f<sub>b</sub>が変化する(約 1 MHz/1 度).OTDR と同様の測定系によって得た後方ブリュアン散乱光の信号波形の光周波 数依存性を解析し、f<sub>b</sub>の分布を求めることにより、歪み/温度分布を得ることができる.

ラマン散乱光を利用した温度センサは、散乱係数の温度依存性を利用している. ラマン散乱 では、入射光と振動する分子一つひとつとがエネルギーを授受するので、散乱光の周波数はシ フトする(石英ガラスの場合、約13 THz).低いエネルギー準位にある分子にエネルギー $\Delta E$ を 与え、低周波側にシフトした光をストークス光と呼ぶ.逆に、 $\Delta E$ だけ高いエネルギー準位に ある分子からエネルギーを受け取り、高周波側にシフトした光を反ストークス光と呼ぶ.その 散乱係数は各エネルギー準位にある分子数に比例し、またその分子数は統計力学によりボルツ マン分布に従う.よって、反ストークス光とストークス光の散乱強度の比は、exp( $-\Delta E/k_BT$ ) に比例する( $k_B$ :ボルツマン定数、T:絶対温度).そこで、この強度比の分布を OTDR と同様 の測定系によって得ることにより、温度分布の測定を可能としている.このとき、光ファイバ の損失による光強度変化は補償される.実際には、ストークス光と反ストークス光の波長の違 いによる損失差や遅延時間差も事前校正し、測定精度を高めている.

#### (3) 光ファイバジャイロ

回転するループ状の光路を右回りと左回りで伝搬する光の位相に差が生じる現象をサニャック(Sagnac)効果と呼ぶ.この位相差 θ が回転角速度 Ωに比例することを利用し,回転角速 度あるいは回転量を検出するセンサを光ジャイロという.位相差 θ はループが囲む総合の面積 に比例するので,このループを多層巻の光ファイバコイルにし,高感度化,小型化,高信頼度 化を図ったものが光ファイバジャイロである.位相差 θの測定方法にはいくつかの方式がある が,両光を干渉させ,その強度変化から回転角速度を測定する,干渉型光ファイバジャイロ(I-FOG:Interferometric Fiber-optic Gyroscope)が最初に実用化され,広く使用されている.雑音を 極力抑えるためには,無回転時の両光の光路長は周囲環境に変化があったときも等しく保つ必 要がある(相反性の確保).そこで,カップラの分岐比の温度変動による雑音などが生じないよ う,光ファイバコイルに接続したカップラ(図2・14 では Y 分岐)と、コイルから戻ってきた 光を光検出器に導くカップラを別に設けている.更に、光ファイバコイル伝搬時の偏光状態の 変化による雑音も生じないよう,偏光子を挿入し,不用偏光成分は除去している.いま、二光 波の位相差を $\theta$ とすると、その干渉信号強度は cos<sup>2</sup>( $\theta$ /2)に比例する.よって、このままでは 低い回転角速度は検出しにくいので、 $\pi$ /2だけ位相バイアスした検出信号とすることが望まし い.そこでコイルの片端に位相変調器を挿入し、両光の間に、光ファイバの伝搬による遅延時 間差  $\tau$  をつけた位相変調をかける(位相変調法).このとき干渉信号に含まれる変調周波数成 分の振幅は sin  $\theta$ に比例するため、低い回転角速度に対して感度が得られ、また回転方向も分 かるようになる.しかしこの場合においても、入力回転角速度に対する出力は線形ではなく、 また大きな回転角速度は測定できないという問題が残る.そこで、回転速度測定量を帰還させ た零位法も採用することにより、高ダイナミックレンジ化が図られている.帰還は、上述の位 相変調法のときと同様にして、右回り光と左回り光の間に、光ファイバの伝搬による遅延時間 差  $\tau$  をつけた、鋸歯状波による位相変調によって行っている.このとき鋸歯状波のスロープと  $\tau$ の積で決まる帰還信号が得られる.



図2・14 干渉型光ファイバジャイロの構成例

以上の2種類の位相変調方法として、アナログ方式に加え、ディジタル方式も開発されている(図2・14の変調信号を参照).ディジタル信号処理技術の発展と相俟って、高精度、高安定な光ファイバジャイロが実現されている.また、I-FOGに加え、サニャック効果による、リング共振器の共振周波数の変化を捕える共振器型光ファイバジャイロ(R-FOG: Resonant-FOG)や、ブリュアン光ファイバレーザの発振周波数差の変化を捕えるブリュアン光ファイバジャイロ(B-FOG: Brillouin-FOG)、更に、光ファイバコイル部での雑音低下を狙い、空気コア・フォトニック結晶ファイバを使用した R-FOG など、次世代の光ファイバジャイロの研究開発が進展している.

## ■9 群-8 編-1 章

# 1-3 化学・生物センサ

## 1-3-1 嗅覚センサ

S2 群7編 バイオナノテクノロジー3章 3-1-9項参照.

#### 1-3-2 味覚センサ

S2 群7編 バイオナノテクノロジー3章 3-1-10 項参照.

## 1-3-3 イオンセンサ

(執筆者:宮原裕二) [2018年6月受領]

イオンセンサはイオン選択性電極とも言われ,その主要部は図 3·3·1 に示すように,イオン 感応膜,内部電極,内部溶液から構成されている.



図3・3・1 イオン電極の構成

試料中の目的イオン濃度に応じてイオン感応膜で発生する起電力*E*を,比較電極を基準として測定する.イオン感応膜が特定のイオンiのみに選択的に応答し, 膜中を電流が流れないという理想的な場合,イオン感応膜で発生する起電力*E*は式(3·3·1)で表される.

$$E = E_i^0 + (RT/z_iF)\ln(a_i)$$

 $(3 \cdot 3 \cdot 1)$ 

ここで、 $E_i^0$ :標準電位、R:気体定数、T:絶対温度、 $z_i$ :イオンの価数、F:ファラデー定数、  $a'_i$ :試料中のイオン i の活量を表す. ( $RT/z_iF$ )はネルンストの傾きといいイオンセンサの応答 を評価する指標となり、式(3·3·1)を常用対数で書き換えて次のように表される.

 $2.303 RT/z_{i}F = 59.16 \text{ mV}/z_{i} \quad (25^{\circ}\text{C}) \quad (3\cdot3\cdot2)$ 

これより、1 価のイオンについて、試料中の濃度が 1 桁変化したときの起電力変化は 25℃で



図3・3・2 イオン感応性電界効果トランジスタの構造

59.16 mV となる.

図 3・3・1 に示したイオン感応膜を図 3・3・2 に示すように絶縁ゲート電界効果トランジスタの ゲート絶縁膜上に直接形成した構造のイオンセンサをイオン感応性電界効果トランジスタ

(Ion Sensitive Field Effect Transistor: ISFET)という<sup>1)</sup>. ゲート電位は同じ試料溶液中に浸せき した参照電極により制御される. 試料溶液中のイオン濃度が変化すると、イオン感応膜で起電 力が変化する. この起電力変化が電界効果トランジスタのゲート電圧変化と同様に作用して、 電界効果によりシリコン表面のチャネルの導電率を変化させ、ドレイン電流の変化として測定 される. あらかじめ検量線を作成しておけば、ドレイン電流変化からイオン濃度を求めること ができる. ISFET は半導体技術により製作されるため、下記の特徴がある.

- (1) FET はインピーダンス変換機能を有するため、絶縁性の材料でもイオン感応膜として用いることができる.
- (2) 微細加工技術により小型のイオンセンサチップを製作することができる.
- (3) 複数のイオンセンサや信号処理回路をワンチップに集積化することができる.

イオン感応膜としては従来のイオン電極に用いられている材料を ISFET に適用することが 可能である.それに加えて(1)の特徴を利用して,半導体プロセスとの整合性が良い Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>が ISFET に使用される pH 感応膜材料として開発されている. これらの材料は Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>< Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub><Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>の順にネルンストの傾きや安定性が良いとの報告があるが<sup>2)</sup>, 膜形成方法や条件 により pH 応答特性が変わることが知られている. Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>は通常半導体デバイス では絶縁膜として用いられているが,溶液中に浸漬して水素イオン(pH)感応膜として機能し, 溶液/絶縁膜界面において起電力が発生する. SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>などの酸化物は水溶液中に浸 漬すると,その表面が水和化してヒドロキシル基が生成され,水素イオンの結合,解離サイト となる.一方,Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>は酸化物ではないが,水溶液中に浸漬すると表面に酸素原子が現れること がオージェ電子分析の結果明らかになっており,やはりその表面が水和化してヒドロキシル基 が生成されると考えられている.

ISFET のゲート絶縁膜表面に機能性膜を形成することにより、検知対象や選択性を変えるこ

とができる. FET と高分子イオン感応膜,固定化酵素,抗体,あるいは DNA とを組み合わせ ると,Na<sup>+</sup>や K<sup>+</sup>などのイオン,グルコースや尿素などの生化学成分,抗原-抗体反応,あるいは DNA を検出する FET を製作することができる.半導体集積回路技術を用いて高密度に集積化 した ISFET アレイと DNA の伸長反応を組み合わせて,DNA シーケンサが開発され,実用化さ れている<sup>3</sup>.

#### ■参考文献

1) P. Bergveld : IEEE Trans. on Biomed. Eng., BME-17, 70, 1970.

2) H. Abe, et al. : IEEE Trans. Electron Device, ED-26, 1939, 1979.

3) J.M. Rothberg, et al. : Nature, vol.475, 21 July, pp.348-352, 2011.

## 1-3-4 酵素センサ

(執筆者:六車仁志) [2012年5月受領]

酵素センサは、酵素の基質特異性を利用し、酵素反応によって生じる電極活物質の増減を電 極で電気化学的に検出する.このとき、検出は電流値を測定することになるのでアンペロメト リックセンサとも呼ばれる.代表的な酵素センサの一種、グルコースバイオセンサの測定原理 は次のとおりである(図3・4・1).すなわち、酵素グルコースオキシダーゼ(GOD)によりグル コースは酸化され、反応により、式(3・4・1)のように過酸化水素が生成される.

グルコース + 
$$O_2$$
 GOD グルコン酸 +  $H_2O_2$  (3・4・1)

生成した過酸化水素は、電極を+0.7 V 程度に設定することにより式(3・4・2)のような反応が 起こり、電流値が増加する.この電流値の増加を測定することでグルコースの濃度が測定でき る.

$$\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{2} \rightarrow 2\mathrm{H}^{+} + \mathrm{O}_{2} + 2\mathrm{e}^{-} \tag{3.4.2}$$

または、式(3·4·1)に示すように、この反応は酸素を消費するので、酸素電極を用いてもグルコ ース濃度を測定できる.



図3·4·1 過酸化水素電極を用いるグルコースバイオセンサの動作原理

この電極型のバイオセンサは、図3・4・2に示すようなフロー式と呼ばれる形態で利用される.



図3・4・2 フロー型測定システム

フロー型では、フロー系を作るのにペリスタポンプ、チューブ、試料注入口、フロー液などを 用意し、フロー液の流速、組成、測定アルゴリズムなどを最適化する必要がある.これにより、 多くの試料を短時間で測定できる.また、測定試料の注入を自動化すれば連続測定も可能であ る. 医療検体検査、細胞培養、発酵プロセス、食品分析などが用途である.したがって、測定 試料は、血液、発酵溶液、細胞培養用培地、生体試料、清涼飲料水、牛乳などで、ほとんど前 処理なしで測定できる.測定は、全自動でプログラムにより、測定間隔、条件などを自由に制 御できる.また、発酵プロセスでは、コンタミネーションをさけるために無菌状態で生物培養 槽から直接サンプリングが可能であり、そのシステムの部品はすべて殺菌(オートクレーブ) できる.これらの酵素センサは、グルコースのほかにも、ラクテート、グルタミン、グルタミ ン酸、スクロース、エタノール、メタノールなども同時に測定できる.これらの物質は、酵素 を代えることにより、同様の測定原理で測定することができる.

血液中のグルコースを測定したい場合,血液をセンシング部に付着させる.血液は,様々な 病原菌が存在し,感染のおそれもあるため,取り扱いには注意が必要である.このため,一度 血液を付着させたチップは,洗浄して再使用することはできず,使い捨てにすることが望まし い.使い捨てセンサの形態は,図3・4・3に示すように,センサチップに血液を付着させ,測定 機器に挿入すると測定値が表示される.その後,チップは取り除き捨てることになる.再び測 定するときには,新たな別のチップを使用する.このセンサの測定原理は,酵素を利用してい



るが、更に大きな特徴は、メディエータを使用している点である. 電極型のグルコースバイオ センサは、酵素反応によって増減する酸素または過酸化水素の量を電極で検出した. これに対 し、メディエータ型のバイオセンサは、図3・4・4 に示すように酵素反応によって生じる電子を 直接電極で検出する. グルコースオキシダーゼの活性中心に FAD という補酵素が存在し、こ の FAD が酸化還元されることで電子の移動が起こる. しかし、FAD は巨大な分子の内部に埋 もれているために FAD から直接電極に電子を受け渡すことができない. そのために、メディ エータを利用することによって電極への電子伝達が可能になった.



図3・4・4 メディエータの役割

メディエータを使用する利点は、酵素反応に酸素が必要でない.高濃度のグルコースを測定 には、酵素反応に必要な酸素量が不足すると電流値が飽和して正確なグルコース濃度を測定で きない.このほかには、血液中には、電極反応する成分が存在する.アスコルビン酸、尿酸、 アセトアミノフェンがそうである.この電極活物質の存在によっても電流値が増加するので正 確なグルコース濃度を測定することはできない.この対策としては、妨害物質を除去する膜を 電極上に使用されているが、メディエータを使用することで更に妨害物質の影響を抑えること ができる.先に述べた過酸化水素電極型のグルコースバイオセンサでは、過酸化水素を検出す るためにアノードを +0.6 V に設定する.これに対し、多くのメディエータを使用した場合に はアノードを +0.3~0.4 V でよい.より低い電位で検出に充分な電流値を得ることができる アノード電位が低いと電極活物質と電極反応によって生じる電流を少なくすることができる ので正確な血糖値を測定することができる.このセンサは、一型糖尿病患者の血糖値管理には 欠かせないが、健康な人や糖尿病予備軍の人にとっても、普段の健康管理に利用して、予防医 学に貢献できる.

最近の動向は、ナノテクノジーの進歩により、ナノ構造を持つ物質の作製評価が進み、それ らのバイオセンサの利用が顕著である.ナノ材料のナノ構造のサイズレベルは、生体分子のサ イズとほぼ同等になり、生体分子と信号変換素子を組み合わせる際に、その界面構造の構成制 御がより精密容易になり、高機能なバイオセンサの報告が増えている.ナノ材料の中でも、カ ーボンナノチューブが特に多く利用されている.カーボンナノチューブについては、S2 群 2 編 3 章に記載されている.

## 1-3-5 生物センサ